

日本顕微鏡学会 超分解能電子顕微鏡分科会 第4回研究会 「次世代顕微鏡への取り組み」

近年、電子顕微鏡の分解能が格段に向上し、電子顕微鏡を用いた研究が一段と盛んになっている。装置と手法の進展により、高分解能での構造観察と分析が可能となり、ナノスケールのデバイス開発等に関連した応用研究が精力的に進められている。また、電子顕微鏡像の定量解析に向けた研究や共焦点 STEM による 3 次元観察などの手法開発が進められている。本研究会では、次世代顕微鏡に向けた取り組みをされている研究者の方々に、顕微鏡研究の進展の現状と今後の発展に向けたお話を伺う。

日時 平成 21 年 3 月 14 日 (土) 13:30-16:30

場所 東京工業大学 大岡山キャンパス 本館 1 階 36 号室

参加費 無料

講演

- 13:30 - 14:10 「共焦点 STEM による 3 次元観察に向けて」
三石和貴、竹口雅樹、橋本綾子 (物質・材料研究機構)
- 14:10 - 14:50 「STEM 像定量解析に向けて」
山崎貴司、小高康稔 (富士通研究所)
- 14:50 - 15:10 休憩
- 15:10 - 15:50 「STEM による原子スケール元素分析に向けて」
五十嵐信行 (NEC)
- 15:50 - 16:30 「STEM-EELS 定量解析に向けて」
奥西栄治 (日本電子)

アクセス

東急目黒線・大井町線 大岡山駅下車 徒歩 5 分



大岡山駅より大学正門が見えます。
本館の正面玄関よりお入り下さい。
(左図参照)
正面玄関に案内係がおります。

分科会責任者 谷城 康真 (東工大 院理工)

第4回研究会世話人 (問合せ先): 大島 義文 (東工大 院総理工)

TEL: 045-924-5619、E-mail: oshima.y.aa[@]m.titech.ac.jp